

Resonancias plasmónicas dipolares en nanoelipsoides: análisis de contribuciones interbanda e intrabanda en el régimen cuasiestático

Luna González, D. Larissa¹, Urrutia Anguiano, Jonathan A.² y Reyes Coronado, Alejandro³
Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

dana.larissalg@ciencias.unam.mx, ²jaurrutia.95@ciencias.unam.mx, ³coronado@ciencias.unam.mx

Acerca de las funciones dieléctricas

Se emplearon los ajustes a datos experimentales reportados por [1]. Para la parte **intrabanda** se empleó el modelo de Drude [2] con los parámetros

$$\varepsilon_{\text{intra}}(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\omega\gamma_0}$$

Para el oro:

$$\hbar\omega_p = 9.03 \text{ eV}, \quad \hbar\gamma_0 = 1 \times 10^{-3} \text{ eV}$$

Para el aluminio:

$$\hbar\omega_p = 15.6 \text{ eV}, \quad \hbar\gamma_0 = 1.007 \times 10^{-1} \text{ eV}$$

Para la parte **interbanda** se empleó el modelo de Orosco y Coimbra [3] con los parámetros

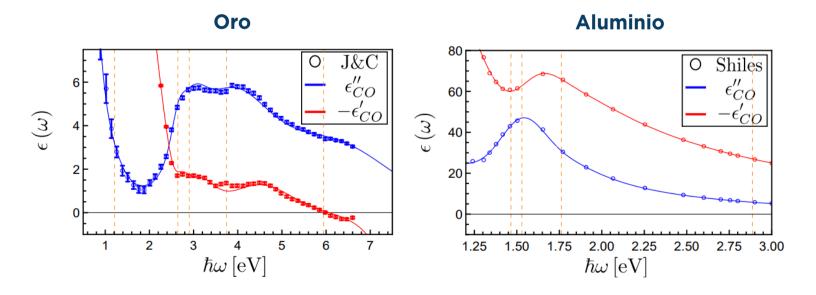
$$\varepsilon_{\mathrm{inter}}(\omega) = \frac{\omega_p^2 f}{\omega_0^2} \left[\frac{s(z_+) + s(z_-)}{\chi_0} \right]$$

Para el oro:

i	f_i	$\hbar \gamma_i \; [\mathrm{eV}]$	$\hbar\omega_i \; [\mathrm{eV}]$	σ_i
1	1.186×10^{-3}	1×10^{-3}	1.213	1.939×10^{-1}
2	8.410×10^{-1}	1×10^{-3}	8.167	10^{-5}
3	6.129×10^{-3}	1×10^{-3}	2.642	1.356×10^{-1}
4	4.969×10^{-1}	1.124×10^{-1}	2.784×10^{-1}	10^{-5}
5	2.911×10^{-1}	1×10^{-3}	3.743	8.416×10^{-1}
6	6.051×10^{-1}	1×10^{-3}	5.945	1.440
7	4.919×10^{-2}	1.531×10^{-1}	2.901	3.003×10^{-1}

Para el aluminio:

i	f_i	$\hbar \gamma_i \; [\mathrm{eV}]$	$\hbar\omega_i \; [\mathrm{eV}]$	$\sigma_{\pmb{i}}$
1	6.685×10^{-2}	6.269×10^{-1}	1.762	5.226×10^{-2}
2	2.772×10^{-2}	1.109×10^{-3}	1.529	1.261×10^{-1}
3	1.401×10^{-1}	1.191	1.465	6.698×10^{-1}
4	5.276×10^{-2}	1.749	2.886	1.144
5	1.236×10^{-2}	3.009×10^{-1}	4.764×10^{-1}	8.808×10^{-2}



- [1] D. Espinosa. Tesis de Licenciatura (Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2022)
- [2] C. F. Bohren y D. R. Huffman. Absorption and scattering of light by small particles. 2008
- [3] J. Orosco y C.F.M. Coimbra. Applied Optics, 57 (19)